УДК 546:548.736.4

Н. М. Муць, Я. О. Токайчук, М. О. Бойко, П. Ю. Демченко, член-кореспондент НАН України Р. Є. Гладишевський

Представники структурного типу $Sc_2Re_3Si_4$ у системах $R-{Ti, Zr, Hf}-Si$ (R — рідкісноземельний метал)

За результатами рентгенофазового, рентгеноструктурного та локального рентгеноспектрального аналізів встановлено існування одинадцяти нових сполук із структурою типу Sc₂Re₃Si₄: Dy₂{Zr, Hf}₃Si₄, Ho₂{Zr, Hf}₃Si₄, Er₂{Zr, Hf}₃Si₄, Tm₂{Zr, Hf}₃Si₄, Lu₂{Ti, Zr, Hf}₃Si₄ та підтверджено існування при температурі 870 K сполук Tb₂Ti₃Si₄ й Er₂Ti₃Si₄. Встановлено, що при переході від титану до цирконію параметри елементарних комірок ізоструктурних сполук закономірно збільшуються, а при переході від цирконію до гафнію — зменшуються.

При дослідженні ізотермічних перерізів діаграм стану систем Tb–Zr–Si [1] та Tb–Hf–Si [2] при температурі 870 K встановлено існування двох сполук Tb_{2-1,54}Zr_{3-3,46}Si₄ й Tb₂Hf₃Si₄ з тетрагональною структурою типу Sc₂Re₃Si₄ (просторова група (ПГ) $P4_12_12$, символ Пірсона (СП) tP36).

Аналіз наукових публікацій [3–8] показав, що сполуки, ізоструктурні до Sc₂Re₃Si₄, утворюються також у потрійних системах Sc–{V, Cr}–Si, {Gd, Tb, Dy, Ho, Er}–Ti–Si. Слід зазначити, що тернарна сполука в системі Gd–Ti–Si є дефектною в правильній системі точок атомів Gd, а сполука в системі Tb–Zr–Si володіє незначною областю гомогенності. Згідно з публікаціями [7, 8], сполуки Gd_{1,9}Ti₃Si₄, Tb₂Ti₃Si₄, Dy₂Ti₃Si₄, Ho₂Ti₃Si₄, Er₂Ti₃Si₄ виявлені в зразках, гомогенізованих при 1100 K; сполука Dy₂Ti₃Si₄ існує також і при 1200 K. Отже, більшість сполук, ізоструктурних до Sc₂Re₃Si₄, утворюються з рідкісноземельними металами (R) ітрієвої підгрупи та перехідним металом титаном. Мета даної роботи — пошук нових сполук зі структурою типу Sc₂Re₃Si₄ у системах R–{Ti, Zr, Hf}–Si при 870 K.

Методом електродугового сплавляння виготовлено 24 зразки складу $R_{22,2}T_{33,3}Si_{44,5}$, де R = Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu; T = Ti, Zr, Hf. Для синтезу використовували чисті полікристалічні прості речовини: рідкісноземельний метал з масовим вмістом основного компонента не менше 99,85%, Ti 99,93%, Zr 99,89%, Hf 99,9%, Si 99,999%. Сплави піддавали відпалу, що гомогенізує, впродовж 1500 год при 870 K у вакуумованих кварцових ампулах у муфельній електропечі VULKAN A-550. Гомогенізовані сплави загартовували в холодній воді без попереднього розбивання ампул. Сплави мали металічний блиск та були стабільними на повітрі.

Рентгенівський фазовий аналіз полікристалічних зразків проведено на підставі даних, отриманих на порошковому дифрактометрі ДРОН-2.0 М (Fe $K\alpha$ проміння). Структуру уточнювали методом Рітвельда за допомогою програм DBWS-9807 [9] та пакета програм FullProf Suite [10]. Для пошуку прототипів використовували базу даних TYPIX [11], а для графічного зображення структур — програму DIAMOND [12].

З метою підтвердження та уточнення результатів рентгенівського фазового аналізу проводили енергодисперсійний рентгеноспектральний мікроаналіз за допомогою мікроаналіза-

128

[©] Н. М. Муць, Я. О. Токайчук, М. О. Бойко, П. Ю. Демченко, Р. Є. Гладишевський, 2014

тора PEMMA-102–02. Дослідження виконували на шліфах, виготовлених механічним шліфуванням і поліруванням.

На основі рентгенофазового та рентгеноструктурного аналізів підтверджено існування при 870 К двох раніше відомих сполук (Tb₂Ti₃Si₄, Er₂Ti₃Si₄) та встановлено існування одинадцяти нових сполук, ізоструктурних до Sc₂Re₃Si₄: Dy₂{Zr, Hf}₃Si₄, Ho₂{Zr, Hf}₃Si₄, Er₂{Zr, Hf}₃Si₄, Tm₂{Zr, Hf}₃Si₄, Lu₂{Ti, Zr, Hf}₃Si₄ (табл. 1). Усі зразки виявились багатофазними, з масовим вмістом основної фази не менше 70 %. Додатковими фазами головним чином є сполуки зі структурами типів AlB₂ (ПГ *P6/mmm*, СП *hP3*), CrB (ПГ *Cmcm*, СП *oS8*) або Mn₅Si₃ (ПГ *P6₃/mmc*, СП *hP1*6); довготривалий відпал (3000 год) не дозволив отримати однофазні зразки. Варто відзначити. що дифрактограми деяких зразків містять піки, що не належать жодній із бінарних сполук. Це може свідчити про існування інших нових тернарних сполук у цих системах.

Для окремих сплавів проведено локальний рентгеноспектральний аналіз (рис. 1). Уточнені склади добре узгоджуються з вихідними. Нами проведено повне уточнення структури методом Рітвельда на основі дифракційних даних від полікристалічного зразка $Dy_{22,2}Hf_{33,3}Si_{44,5}$, гомогенізованого при 870 К впродовж 1500 год. Результати уточнення демонструє табл. 2, а дифрактограму зразка — рис. 2, *a* (див. вклейку). Зразок містить 73% за масою тернарної сполуки $Dy_2Hf_3Si_4$ з тетрагональною структурою типу $Sc_2Re_3Si_4$, 14% за масою бінарної сполуки DySi з ромбічною структурою типу CrB та 13% за масою бінарної сполуки DySi з ромбічною структурою типу Mr_5Si_3 . Координати та ізотропні параметри зміщення атомів у структурі сполуки $Dy_2Hf_3Si_4$ (CT $Sc_2Re_3Si_4$, CII tP36, IIF $P4_12_12$, a = 0,7200(2), c = 1,3187(5) нм) представлені в табл. 3.

Повне уточнення структури проведено методом Рітвельда на основі дифракційних даних від полікристалічного зразка Dy_{22,2}Ti_{33,3}Si_{44,5}, гомогенізованого при температурі 870 К впродовж 1500 год. Результати фазового аналізу демонструє табл. 4, а дифрактограму зразка — рис. 2, *б*.

Зразок складу $Dy_{22,2}Ti_{33,3}Si_{44,5}$ синтезували з метою підтвердження раніше відомої сполуки $Dy_2Ti_3Si_4$ (структура типу $Sc_2Re_3Si_4$), однак ця сполука при температурі відпалу 870 К нами не була виявлена. Основною фазою (72% за масою) в зразку є фаза $Dy_3Ti_2Si_4$ зі структурою бінарного типу Zr_5Si_4 . Атоми Dy й Ti утворюють статистичні суміші в трьох правильних системах точок. Координати атомів та ізотропні параметри зміщення атомів

Сполука	Параметри	$V m^3$	
	a	С	<i>v</i> , HM
$\mathrm{Tb}_{2}\mathrm{Ti}_{3}\mathrm{Si}_{4}$	0,7014(2)	1,2898(6)	0,6345(4)
$\mathrm{Dy}_{2}\mathrm{Zr}_{3}\mathrm{Si}_{4}$	0,7236(2)	1,3249(6)	0,6937(4)
$Dy_2Hf_3Si_4$	0,7200(2)	1,3187(5)	0,6836(4)
$\mathrm{Ho}_{2}\mathrm{Zr}_{3}\mathrm{Si}_{4}$	0,7208(2)	1,3200(5)	0,6857(4)
$Ho_2Hf_3Si_4$	0,7170(2)	1,3087(5)	0,6728(4)
$\mathrm{Er}_{2}\mathrm{Ti}_{3}\mathrm{Si}_{4}$	0,6985(1)	1,2809(4)	0,6249(3)
$\mathrm{Er}_{2}\mathrm{Zr}_{3}\mathrm{Si}_{4}$	0,7229(3)	1,3249(6)	0,6924(5)
$\mathrm{Er}_{2}\mathrm{Hf}_{3}\mathrm{Si}_{4}$	0,7170(3)	1,3096(6)	$0,\!6733(5)$
$\mathrm{Tm}_2\mathrm{Zr}_3\mathrm{Si}_4$	0,7222(4)	1,3920(1)	$0,\!6884(7)$
$\mathrm{Tm}_{2}\mathrm{Hf}_{3}\mathrm{Si}_{4}$	0,7198(4)	1,315(1)	$0,\!6813(8)$
$Lu_2Ti_3Si_4$	0,6980(2)	1,2775(5)	0,6224(3)
$Lu_2Zr_3Si_4$	0,7225(2)	1,3205(5)	0,6892(4)
$Lu_2Hf_3Si_4$	0,7190(3)	1,3120(6)	$0,\!6783(5)$

Tаблиця1. Параметри елементарних комірок сполук $R_2T_3\mathrm{Si}_4$ із структурою типу $\mathrm{Sc}_2\mathrm{Re}_3\mathrm{Si}_4$

ISSN 1025-6415 Доповіді Національної академії наук України, 2014, № 12



Рис. 1. Фотографії шліфів зразків $Dy_{22,2}Ti_{33,3}Si_{44,5}$ (склад зразка, згідно з рентгеноспектральним аналізом — $Dy_{19,0}Ti_{32,8}Si_{48,2}$) (a), $Dy_{22,2}Zr_{33,3}Si_{44,5}$ ($Dy_{18,1}Zr_{35}Si_{46,9}$) (б) й $Tb_{22,2}Ti_{33,3}Si_{44,5}$ ($Tb_{20,1}Ti_{34,1}Si_{45,8}$) (в) та їхній фазовий склад

Таблиця 2. Результати уточнення структури ме	тодом Рітвельда ;	для зразка Dy _{22,2} H	Н _{33,3} Si _{44,5} (відпал	870 K,
дифрактометр ДРОН-2.0 М, Fe $K\alpha$ проміння)				

Yapawaapucatuka Hapawaapip	Фаза				
Характеристика параметрів	$\mathrm{Dy}_{2}\mathrm{Hf}_{3}\mathrm{Si}_{4}$	DySi	$\mathrm{Hf}_{5}\mathrm{Si}_{3}$		
Вміст, % за масою	73(2)	14(4)	13(5)		
Структурний тип	$\mathrm{Sc}_{2}\mathrm{Re}_{3}\mathrm{Si}_{4}$	CrB	Mn_5Si_3		
Просторова група	$P4_{1}2_{1}2$	Cmcm	$P6_3/mcm$		
Параметри комірки, нм:					
a	0,7200(2)	0,4196(3)	0,7818(5)		
b	—	1,0363(6)	—		
c	1,3187(5)	0,3818(3)	0,5557(5)		
Об'єм комірки, нм ³	0,6836(4)	0,1660(2)	0,2941(4)		
Γ устина, г · см ⁻³	$9,\!452$	$7,\!627$	11,028		
Φ актор шкали S	$0,144(3) \cdot 10^{-4}$	$0,58(2) \cdot 10^{-4}$	$0,116(5) \cdot 10^{-4}$		
Параметр текстури G, напрям	1,03(1)	0,99	$0,\!99$		
	[001]	[010]	[001]		
Φ актор достовірності R_B	0,0927	0,1223	0,0809		
Нульове значення 2θ , град	0,14(1)				
Параметр ширини піків U, V, W	0,95(11), 0, 0,13(2)				
Параметр змішування η	0,70(4)				
Φ актор достовірності R_p (R_{wp})	$0,0677 \ (0,0861)$				
Φ актор добротності S	$1,\!38$				

у структурі сполуки Dy₃Ti₂Si₄ (CT Zr₅Si₄, CП tP36, ПГ $P4_12_12$, a = 0,69967(8), c = 1,2856(2) нм) представлені в табл. 3.

ISSN 1025-6415 Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2014, № 12

130



Рис. 2. Експериментальна, розраховані та різницева дифрактограми зразків $Dy_{22,2}Hf_{33,3}Si_{44,5}$ (*a*) та $Dy_{22,2}Ti_{33,3}Si_{44,5}$ (*b*), гомогенізованих при 870 К (Fe $K\alpha$ проміння)



Рис. 3. Проекції елементарної комірки структури сполуки Dy₂Hf₃Si₄ уздовж кристалографічних напрямів [001] і [010]



Рис. 4. Координаційні багатогранники атомів у структурі сполуки Dy2Hf3Si4

Детальний структурний аналіз проведений на основі дифрактограми зразка Dy_{22,2}Hf_{33,3}Si_{44,5}, який не піддавали відпалу, що гомогенізує. Цей сплав виявився трифазним (див. табл. 4), як і сплав, гомогенізований при температурі 870 К. Основною фазою в цьому зразку є тернарна сполука Dy₂Hf₃Si₄ зі структурою типу Sc₂Re₃Si₄.

Проекції елементарної комірки структури сполуки Dy₂Hf₃Si₄ вздовж кристалографічних напрямів [001] і [010] та координаційні багатогранники атомів ілюструють рис. 3 й 4 (див. вклейку).

Координаційне число (к. ч.) для атомів Dy дорівнює 18, тоді як для атомів Hf — 16 або 14. Координаційним багатогранником для атомів Hf з к. ч. = 14 є ромбододекаедр: куб, утворений атомами великого розміру (Dy й Hf), кожна з граней якого центрована атомом малого розміру (Si). Атоми Si характеризуються тригонально-призматичною координацією: призми побудовані трьома атомами Dy і трьома атомами Hf. Усі тригональні призми мають додаткові атоми навпроти прямокутних граней.

З відомих раніше п'яти тернарних сполук складу R_2 Ti₃Si₄, де R =Gd, Tb, Dy, Ho, Er, нами при температурі 870 K вдалося підтвердити існування лише двох: Tb₂Ti₃Si₄ й Er₂Ti₃Si₄. Це може свідчити про те, що окремі представники структурного типу Sc₂Re₃Si₄ існують у вузьких температурних інтервалах. Параметри елементарних комірок, що уточнені для сполук Tb₂Ti₃Si₄ й Er₂Ti₃Si₄, узгоджуються з параметрами, наданими у літературному джерелі [7]. Незначні відмінності у значеннях параметрів комірок можна пояснити утворенням областей гомогенності, але це припущення потребує додаткового підтвердження.

Таким чином, нами вперше встановлено існування одинадцять нових сполук $Dy_2\{Zr, Hf\}_3Si_4, Ho_2\{Zr, Hf\}_3Si_4, Er_2\{Zr, Hf\}_3Si_4, Tm_2\{Zr, Hf\}_3Si_4, Lu_2\{Ti, Zr, Hf\}_3Si_4.$ Нові сполуки є представниками тетрагонального структурного типу $Sc_2Re_3Si_4$ (СП tP36, ПР гр. $P4_12_12$). Встановлено, що при переході від титану до цирконію параметри елементарних комірок ізоструктурних сполук збільшуються, що пояснюється меншим розміром атома Ті у порівнянні з атомом Zr. Для всіх сполук з цирконієм значення параметрів є більшими у

Атом	ΠCT^*	Koo	Координати атомів			$P = 10^{-2} \text{ ms}^2$		
		x	y	z	KSII	$D_{130}, 10$ HM		
$\mathrm{Dy_2Hf_3Si_4}$								
$\mathbf{D}\mathbf{y}$	8b	-0,002(2)	0,331(2)	0,2163(9)	1	0,4(2)		
Hf1	8b	0,141(2)	0,000(3)	0,368(1)	1	0,4(1)		
Hf2	4a	0,185(2)	0,185(2)	0,000	1	0,4(1)		
Si1	8b	0,288(9)	0,03(1)	0,154(5)	1	0,7		
Si2	8b	0,34(1)	0,24(1)	0,323(6)	1	0,7		
	$\mathrm{Dy}_{3}\mathrm{Ti}_{2}\mathrm{Si}_{4}$							
Dy1	8b	0,011(3)	0,169(3)	0,212(3)	0,86(1)	0,6(2)		
Ti1					0,14(1)			
Dy2	8b	0,506(3)	0,164(2)	0,211(7)	0,21(4)	0,6(2)		
Ti2					0,79(4)			
Dy3	4a	0,316(5)	0,316(5)	0	0,90(3)	0,6(2)		
Ti3					0,10(3)			
Si1	8b	0,198(9)	0,436(7)	0,189(3)	1	0,7		
Si2	8b	0,156(9)	0,182(1)	0,325(2)	1	0,7		

Tаблиця 3. Координати та ізотропні параметри зміщення атомів у структурі сполук Dy2Hf₃Si₄ (CT Sc₂Re₃Si₄) і Dy₃Ti₂Si₄ (CT Zr₅Si₄)

*Правильна система точок; **коефіцієнт заповнення позиції.

ISSN 1025-6415 Доповіді Національної академії наук України, 2014, № 12

Характеристика параметрів	$Dy_{22,2}Hf_{33,3}Si_{44,5}$			${ m Dy}_{22,2}{ m Ti}_{33,3}{ m Si}_{44,5}$		
	$\mathrm{Dy}_{2}\mathrm{Hf}_{3}\mathrm{Si}_{4}$	DySi	$\mathrm{Hf}_5\mathrm{Si}_3$	$\mathrm{Dy}_{3,04(13)}\mathrm{Ti}_{1,96(13)}\mathrm{Si}_4$	$\mathrm{DySi}_{1,67}$	DySi
Вміст, % за масою	71(2)	13(5)	16(4)	72(2)	20(1)	8(1)
Структурний тип	$Sc_2Re_3Si_4$	CrB	Mn_5Si_3	$ m Zr_5Si_4$	AlB_2	CrB
Просторова група	$P4_{1}2_{1}2$	Cmcm	$P6_3/mcm$	$P4_{1}2_{1}2$	P6/mmm	Cmcm
Параметри комірки, нм						
a	0,7214(3)	0,4185(4)	0,7821(4)	0,69967(8)	0,38434(5)	0,4231(3)
b	—	1,041(1)	—	—	—	1,0419(6)
c	1,3209(5)	0,3815(4)	0,5569(5)	1,2856(2)	0,41091(7)	0,3827(3)
Об'єм комірки, нм ³	0,6874(5)	0,1662(3)	0,2950(3)	0,6294(1)	0,05257(1)	0,1687(2)

Таблиця 4. Результати фазового аналізу зразків $Dy_{22,2}Hf_{33,3}Si_{44,5}$ (литий) і $Dy_{22,2}Ti_{33,3}Si_{44,5}$ (відпал 870 К, дифрактометр ДРОН-2.0 М, Fe $K\alpha$ проміння)

порівнянні із значеннями для відповідних ізоструктурних сполук з гафнієм. Це зумовлено дещо більшим атомним розміром Zr у порівнянні з Hf. Підтверджено існування при 870 K двох раніше відомих силіцидів Tb₂Ti₃Si₄ й Er₂Ti₃Si₄.

- 1. *Муць Н. М.* Кристалічна структура нових багатокомпонентних алюмінійсиліцидів та алюмінійгерманідів Pr (Tb) і *d*-елементів Ni (Zr, Hf): Автореф. дис. . . . канд. хім. наук: 02.00.01 / Львів. нац. ун-т. Львів, 2007. 20 с.
- Muts N., Manyako M., Lasocha W., Gladyshevskii R. The Tb-Hf-Si system at 873 K // Chem. Met. Alloys. - 2009. - 2. - P. 187-193.
- 3. Villars P., Cenzual K., Gladyshevskii R. Handbook of inorganic substances 2014. Berlin: De Gruyter, 2014. 1717 p.
- 4. Villars P., Cenzual K., Penzo M. Inorganic substances bibliography 2014. Vol. 1. Berlin: De Gruyter, 2014. 1351 p.
- 5. *Котур Б. Я., Бодак О. И., Заводник В. Е.* Кристаллическая структура соединения Sc₂V₃Si₄ // Кристаллография. 1986. **31**. С. 793–795.
- 6. Печарський В. К., Бодак О. І., Гладишевський Є. І. Сполука Sc₂Re₃Si₄ перший представник структурного типу Zr₅Si₄ серед тернарних силіцидів // Доп. АН УРСР. – 1978. – № 8. – С. 755–759.
- Morozkin A. V., Welter R. New R₂Ti₃Si₄-type compounds and their magnetic properties (R = Gd-Er) // J. Alloys Compd. - 2003. - 348. - P. L1-L2.
- 8. Morozkin A. V. Phase equilibria in the Dy-Ti-Si system at 1200 K // Ibid. 2002. 345. P. 155-157.
- 9. Wiles D. B., Young R. A., Sakthivel A. Program DBWS3.2 for Rietveld analysis of X-ray and neutron powder diffraction patterns // Atlanta (GA): School Phys. Georgia Inst. Technology, 1988. 11 p.
- Rodriguez-Carvajal J. Recent developments of the program FULLPROF // Commis. Powder Diffraction (IUCr), Newsletter. – 2001. – 26. – P. 12–19.
- Parthé E., Gelato L., Chabot B., Penzo M., Cenzual K., Gladyshevskii R. TYPIX Standardized Data and Crystal Chemical Characterization of Inorganic Structure Types: Vol. 1–4. – Heidelberg: Springer, 1993. – 1596 p.
- 12. Brandenburg K. Diamond. Program for crystal and molecular structure visualization. Bonn: Crystal Impact, 1999.

Львівський національний університет ім. Івана Франка Надійшло до редакції 12.06.2014

132

ISSN 1025-6415 Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2014, № 12

Н. М. Муць, Я. А. Токайчук, М. А. Бойко, П. Ю. Демченко, член-корреспондент НАН Украины Р. Е. Гладышевский

Представители структурного типа $Sc_2Re_3Si_4$ в системах $R-{Ti, Zr, Hf}-Si$ (R — редкоземельный металл)

По результатам рентгенофазового, рентгеноструктурного и локального рентгеноспектрального анализов установлено существование одиннадцати новых соединений со структурой типа $Sc_2Re_3Si_4$: $Dy_2\{Zr, Hf\}_3Si_4$, $Ho_2\{Zr, Hf\}_3Si_4$, $Er_2\{Zr, Hf\}_3Si_4$, $Tm_2\{Zr, Hf\}_3Si_4$, $Lu_2\{Ti, Zr, Hf\}_3Si_4$ и подтверждено существование при температуре 870 K соединений $Tb_2Ti_3Si_4$ и $Er_2Ti_3Si_4$. Установлено, что при переходе от титана к цирконию параметры элементарных ячеек изоструктурных соединений закономерно увеличиваются, а при переходе от циркония к гафнию — уменьшаются.

N. M. Muts, Ya. O. Tokaychuk, M. O. Boyko, P. Yu. Demchenko, Corresponding Member of the NAS of Ukraine R. E. Gladyshevskii

Representatives of the structure type $Sc_2Re_3Si_4$ in $R-{Ti, Zr, Hf}-Si$ systems (R - rare-earth metal)

The existence of eleventh new compounds with the structure type $Sc_2Re_3Si_4$: $Dy_2\{Zr, Hf\}_3Si_4$, $Ho_2\{Zr, Hf\}_3Si_4$, $Er_2\{Zr, Hf\}_3Si_4$, $Tm_2\{Zr, Hf\}_3Si_4$, $Lu_2\{Ti, Zr, Hf\}_3Si_4$ is found on the basis of X-ray phase, X-ray structure, and local energy-dispersive X-ray analyses, and the existence of the compounds $Tb_2Ti_3Si_4$ and $Er_2Ti_3Si_4$ at 870 K is confirmed. It was determined that the unit cell parameters of isostructural compounds consistently increase with the replacement of titanium atoms by zirconium and decrease with the replacement of zirconium atoms by hafnium.